DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010267720

WPI Acc No: 1995-168975/199522

XRAM Acc No: C95-086441 XRPX Acc No: N95-145709

Film forming device for ceramic membrane and metal layer on substrate using hollow anode discharge electric gun and resistance heating to

vaporise ceramic and metal materials respectively

Patent Assignee: SHINKU YAKIN KK (SHIN-N); TAI GOLD KK (TAIG-N); TIGOLD

CORP (TIGO-N); VACUUM METALLURGICAL CO LTD (VACU-N)

Inventor: MINATO M; OISHI M; SATO M

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

TW 243470 A 19950321 TW 94105933 A 19940630 199522 B

JP 7278800 A 19951024 JP 9493701 A 19940406 199551

Priority Applications (No Type Date): JP 9493701 A 19940406

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

TW 243470 A 4 C23C-014/26 JP 7278800 A 8 C23C-014/24

## Abstract (Basic): TW 243470 A

A film layer forming device has components installed in the vacuum tank (51): a substrate (14), which is connected to a bias power source (15); a first vaporisation source (22), which uses hollow anode discharge electric gun (21) to vaporise material in order to cover a layer of ceramic membrane on the substrate (14); and a second vaporisation source (32), which is used to assist the hollow anode discharge electric gun (21) and uses resistance heating to vaporise material in order to cover a layer of metal membrane on the ceramic membrane.

Dwg.0/4

Title Terms: FILM; FORMING; DEVICE; CERAMIC; MEMBRANE; METAL; LAYER; SUBSTRATE; HOLLOW; ANODE; DISCHARGE; ELECTRIC; GUN; RESISTANCE; HEAT; VAPORISE; CERAMIC; METAL; MATERIAL; RESPECTIVE

Derwent Class: L03; M13; V05

International Patent Class (Main): C23C-014/24; C23C-014/26

File Segment: CPI; EPI

章 民 國

[1]]公告楊號:243470

(44)中華民國84年(1995)03月21日

(51) Int-C | 5: c23C14/26

图 專 利 公 報 (19)(12) 第 9110 0254號 河 部 (并無)引証附件 全 4 N

(54)名

稍:被理顺形成装置及其被理顺形成方法

(21)申請案號:83105933

(22)中韓日期:中華民國83年(1994)06月30日

(72) 發明人:

谑道夫 大石政治

门本

日本

佐藤勝

日本

〔71〕中 辞 人:

真空冶金股份有限公司 钛金股份有限公司

日本日本

1-1 -4-

10.

(74)代 盟 人:陳燦暉 先生 洪武雄 先生

1

## [57]申請專利範圍:

- 1 一種被覆膜形成裝置,其特徵在:於 真空槽(51)內,設:連接於偏壓電源 (15)之基材(14);爲於該基材(14)上 形成陶瓷被覆膜而利用空心陰極的 電電子鎗(21)使蒸發原料蒸發的第 1 蒸發源(22);反應氣體之導入口 (44);以及爲前述空心陰極放電電子 鎗(21)所輔助而使金屬被覆膜形成的 前述陶瓷被覆膜之上而用之以電阻加 熟方式使蒸發原料蒸發之第2蒸發源 (32)而成者。
- 2.一種被覆膜形成方法,其特徵在: 於真空槽 (51)內,對連接於偏壓電標 (15)之基材 (14),在反應氣體之共會 下利用空心陰極放電電子館 (21)使 作第 1 蒸發源之蒸發原料之 Ti, Cr Zr, Hf 中之任一種蒸發而形成中 化物,氧化物,碳化物,硼化物或退 些化合物複合物而成之陶瓷被覆膜加 其次停止述反應氣體,利用電阻加熱 方式一面使當作第 2 蒸發源 (32)之蒸

發原料之Au,Ag,Pt,Pd,Rh,Ni,Cr,Al,Cu之單體或這些元素之2~3種所成之合金蒸發,而一面經由來自前述空心陰極放電電子鎗(21)之電漿使前述第2蒸發源(32)之蒸發原料之蒸發離子化,於前述陶瓷

3.如申請專利範圍第2項所述之被覆 膜形成方法,其中前述第2蒸發源 (32)之蒸發原料之蒸氣離子化時之前 述空心陰極放電電子館(21)之輸出電 力爲使前述第1蒸發源(22)之蒸發原 料不致蒸發之水準之輸出電力。

被覆膜之上形成金屬被覆膜而成者。

4.一種被覆膜形成方法,其特徵在: 於真空槽(51)內,對連接至偏壓電源 (15)之基材(14),在反應氣體之共存 下利用空心陰極放電電子館(21)使當 作第1蒸發源之蒸發原料之Ti,Cr, Zr,Hf中之任一種蒸發而形成由氮 化物,氧化物,碳化物,硼化物或違 些化合物之複合物而成之陶瓷被覆膜

2